

**УСИЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ  
МАГНИТОСТАТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ  
В ФОТОВОЗБУЖДЕННОЙ СТРУКТУРЕ  
ФЕРРИТ-ПОЛУПРОВОДНИК**

A.C.Кинджак

Известно, что в феррит-полупроводниковой структуре, помещенной в постоянное электрическое поле, возможно усиление поверхностных магнитостатических волн (ПМСВ) [1,2].

В данной работе теоретически показана возможность усиления ПМСВ в структуре светочувствительный полупроводник-феррит в отсутствие внешнего электрического поля. Геометрия задачи представлена на рис. 1. Структура с шириной  $W$ , состоящая из пленки феррита и пленки полупроводника с толщинами  $d$  и  $t$  соответственно, помещена в постоянное магнитное поле  $H_0$ , направленное по оси  $Z$ . ПМСВ распространяется вдоль оси  $Y$ . Перпендикулярно поверхности вдоль оси  $X$  полупроводниковая пленка освещается светом с частотой  $\nu$ , несколько большей частоты межзонных переходов. В этом случае носители заряда, образующиеся в основном около поверхности, диффундируют в глубь образца, приводя к возникновению диффузионного тока. Вследствие равенства нулю составляющей полного тока в направлении нормали к освещенной поверхности появляется электрическое поле  $E_0^x$ . Кроме того, в магнитном поле, направленном параллельно освещаемой поверхности, носители заряда разного знака будут дрейфовать к противоположным сторонам образца вдоль оси  $Y$ . Это вызывает появление электрического поля  $E_0^y$  (фотоэлектромагнитный эффект) [3]. При увеличении интенсивности света  $I$  концентрация фотовозбужденных носителей тока растет и напряженности полей  $E_0^x$  и  $E_0^y$  могут стать достаточно большими, чтобы влиять на характеристики распространяющейся в феррит-полупроводниковой структуре магнитооптической волны. В связи с этим состояние полупроводника будем описывать на основании феноменологического уравнения для общего тока  $J = J_h + J_e$  [3]

$$J = q(\mu_h p + \mu_e n) E - q \operatorname{grad}(D_h p - D_e n) + \\ + q(\theta_h \mu_h p + \theta_e \mu_e n) E \times \epsilon + q \operatorname{grad}(\theta_h D_h p - \theta_e D_e n) \times \epsilon, \quad (1)$$

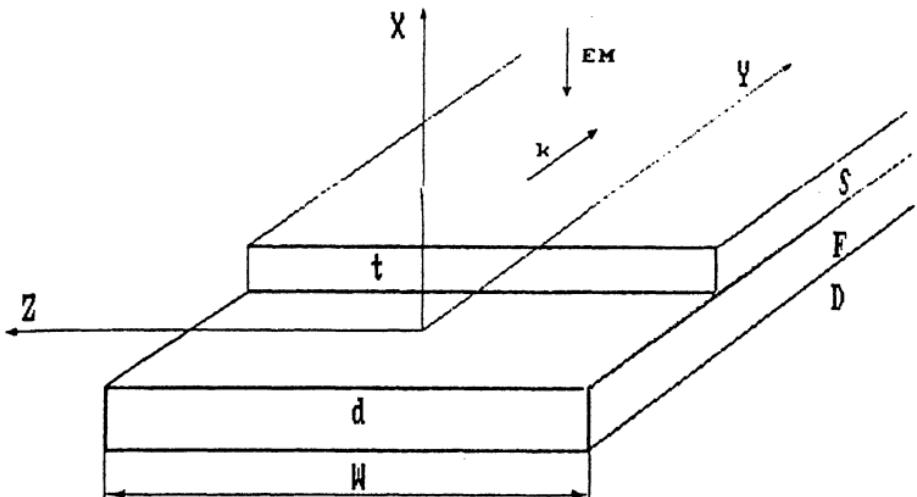


Рис. 1. Геометрия задачи.

где  $\mu_{e(h)}$  — подвижность,  $D_{e(h)}$  — коэффициент диффузии,  $n = n_0 + \delta n$  и  $p = p_0 + \delta p$  — концентрации свободных электронов и дырок, состоящие из начальной ( $n_0$ ) и фотовозбужденной ( $\delta n$ ) частей;  $\theta$  — холловский угол и  $\varepsilon$  — единичный вектор в направлении поля  $H_0$ .

Уравнение (1) содержит четыре слагаемых, которые характеризуют вклад в суммарный ток соответственно дрейфового, диффузионного, холловского и фотоэлектромагнитного эффектов.

Дисперсионное уравнение ПМСВ в планарной структуре феррит-полупроводник, полученное стандартным методом в магнитостатическом безобменном приближении с учетом магнитных потерь из условий непрерывности тангенциальных компонент магнитных полей и нормальных компонент индукции на границах слоев, имеет вид [4]

$$e^{-2kd} = \frac{\mu^- - k}{\mu^+ - k} \cdot \frac{(\delta\mu^+ + k)\operatorname{th}(k_s t) + (\mu^+ + k)\delta^{1/2}}{(\delta\mu^- - k)\operatorname{th}(k_s t) + (\mu^- - k)\delta^{1/2}}. \quad (2)$$

Здесь  $\mu^\pm = k(\mu \pm \mu_a)$ ,  $k_s^2 = \delta k^2$ ,  $k = k' + ik''$ ,  $k$  — волновой вектор, а  $\mu$  и  $\mu_a$  — диагональный и недиагональный элементы тензора магнитной проницаемости феррита, записанные с учетом потерь. Величина  $\delta$  определяет особенности взаимодействия ПМСВ с полупроводниковым слоем и может быть записана в виде

$$\delta = \delta_0 - \frac{i\gamma}{k} + \frac{\beta^2}{2k^2} - \frac{\beta}{k} \left[ \frac{\beta^2}{2k^2} + \delta_0 - \frac{i\gamma}{k} \right]^{\frac{1}{2}}, \quad (3)$$

где  $\delta_0 = 1 - \frac{k_0^2}{k^2}\varepsilon_{zz}$ ,  $\gamma = \sigma_h E_0^y$  и  $\beta = \sigma_h E_0^x + J_f$ , причем  $J_f$  — ток фотоэлектромагнитного эффекта, а  $\sigma_h$  — проводимость

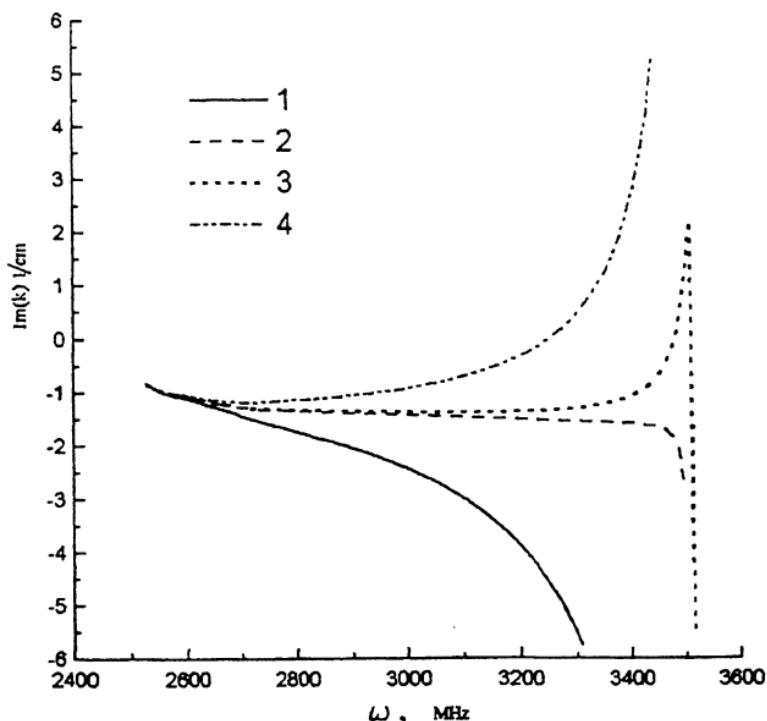
Холла из выражения для общего тока (1). В (3)  $k_0 = \omega/c$ ,  $\varepsilon_{zz} = \varepsilon_{zz}^h + \varepsilon_{zz}^e$ , а  $\varepsilon_{zz}^{e(h)}$  — элемент тензора диэлектрической проницаемости полупроводника в постоянном магнитном поле  $H_0$ .

Концентрация фотовозбужденных электронов  $\delta n$  (дырок  $\delta p$ ) определяется из уравнения непрерывности, которое имеет решение

$$\delta n(x) = A e^{-x/L} + B e^{x/L} + C e^{-\alpha x}, \quad C = \frac{-R\tau_e}{\alpha^2 L^2 - 1}, \quad (4)$$

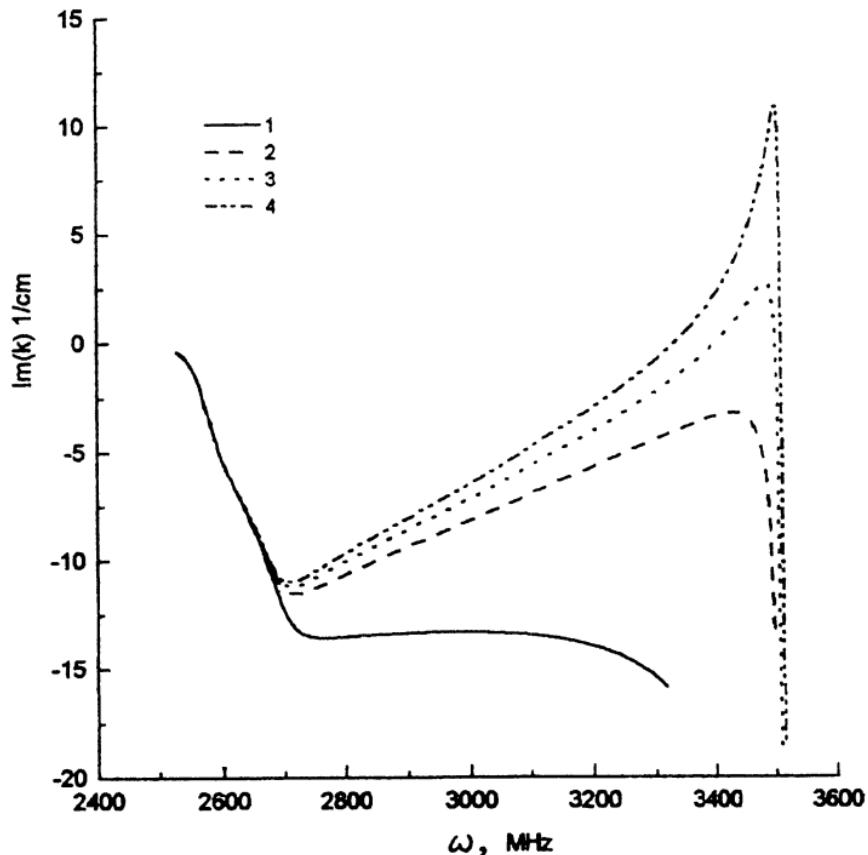
где  $R = \eta\alpha I(I - R_s)/\hbar\nu$ ,  $L^2 = D'_e \tau_e$ . Константы  $A$  и  $B$  находятся из граничных условий. В (4)  $\tau_e$  — время жизни фотовозбужденных электронов,  $\alpha$  — коэффициент поглощения полупроводника,  $\eta$  — квантовый выход и  $D'_e$  — коэффициент амбиполярной диффузии. Выражение для  $\delta p$  имеет аналогичный (4) вид (с заменой значений соответствующих параметров на параметры дырки).

На основании дисперсионного уравнения (2) и выражений (3), (4) для различных соотношений толщин ферритового и полупроводникового слоев были проведены расчеты



**Рис. 2.** Пространственный декремент затухания  $k''(\omega)$  ПМСВ для  $t = 0.0002$  см,  $d = 0.002$  см при  $I$ , Вт/см $^2$ : 1 — 0; 2 — 0.04; 3 — 0.0425; 4 — 0.06.

закона дисперсии  $k'(\omega)$  и пространственного декремента затухания  $k''(\omega)$  ПМСВ. При расчетах использовались значения, близкие по величине к параметрам железоиттриевого граната и CdSe:  $4\pi M_0 = 1750$  Гс,  $H = 720$  Э,  $\mu_h = 50$  см $^2$ /В·с;  $\mu_e = 650$  см $^2$ /В·с;  $n_0 = 10^{17}$  см $^{-3}$ ,  $p_0 = 10^{13}$  см $^{-3}$ ,  $\tau_e = 10^{-3}$  с,  $\tau_h = 10^{-7}$  с,  $\alpha = 5000$  см $^{-1}$ . Расчеты показали, что носители тока в полупроводнике оказывают существенное влияние как на дисперсию, так и на степень затухания ПМСВ в ферритах. Поля  $E_0^x$  и  $E_0^y$  могут быть равными или отличными от нуля в зависимости от того, замкнуты накоротко или нет противоположные грани полупроводникового слоя. С точки зрения ослабления поглощения и усиления ПМСВ интерес представляет случай, когда  $E_0^x = 0$ , а  $E_0^y \neq 0$ . Эти условия выполняются, когда грани полупроводника, перпендикулярные оси  $X$ , замкнуты накоротко, а перпендикулярные оси  $Y$  — нет. Тогда  $\beta=0$ , а поле  $E_0^y$  определяется из уравнения (1) при  $J_y = 0$ .



**Рис. 3.** Пространственный декремент затухания  $k''(\omega)$  ПМСВ для  $t = 0.005$  см,  $d = 0.002$  см при  $I$ , Вт/см $^2$ : 1 — 0; 2 — 0.015; 3 — 0.02; 4 — 0.025.

На рис. 2 приведены зависимости  $k''(\omega)$  ( $\omega$  — частота ПМСВ) при значениях интенсивности света  $I = 0.0 - 0.06 \text{ Вт/см}$ . Видно, что по мере возрастания  $I$  вначале происходит ослабление поглощения ПМСВ и при дальнейшем увеличении интенсивности ее усиление. Усиление начинает проявляться на правой границе спектра ПМСВ и с увеличением  $I$  ширина частотной области усиления растет за счет перемещения левой границы этой области в сторону малых частот. При увеличении постоянного магнитного поля характер приведенных зависимостей не меняется.

На рис. 3 представлены результаты расчетов для случая, когда толщина полупроводникового слоя больше ферритового. С увеличением толщины полупроводника характер усиления меняется и в отличие от рис. 2, где область усиления (ослабления поглощения) при возрастании освещенности практически распространяется на весь диапазон ПМСВ, в этом случае область усиления занимает только часть спектра. Появляется некоторое значение  $\omega_{kp} = \omega(k_{kp})$ , причем при  $\omega < \omega_{kp}$  зависимость  $k''(\omega)$  остается такой же, как в отсутствие фотовозбуждения полупроводника. Усиление ПМСВ проявляется при частотах  $\omega > \omega_{kp}$  и достигается при более низких интенсивностях света.

Таким образом, показано, что фотовозбуждение полупроводникового слоя в тонкопленочной структуре феррит-полупроводник позволяет в широких пределах управлять затуханием магнитостатических волн.

#### Список литературы

- [1] Гулляев Ю.В., Зильберман П.Е. // РЭ. 1978. Т. 23. № 5. С. 897.
- [2] Лукомский В.П., Цвирко Ю.А. // ФТТ. 1973. Т. 15. № 3. С. 700.
- [3] Броэзер И. Физика и химия соединений  $A^2A^6$  // Под ред. проф. С.А. Медведева. М.: Мир, 1970. С. 373.
- [4] Кинджак А.С. // ЖТФ. 1994. Т. 64. В. 11. С. 99–104.

Институт физики твердого тела  
и полупроводников АНБ  
Минск

Поступило в Редакцию  
13 июля 1995 г.